November 29th, 2020

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА nCdS/pCdTe C ТОНКИМ ПЕРЕХОДНЫМ i- СЛОЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ш.Б.Утамурадова,

Научно-исследовательского института физики полупроводников и микроэлектроники при

С .А.Музафарова

Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г.Ташкент, Узбекистан.

E-mail: samusu@rambler.ru

Аннотация.

В работе исследованы вольтамперные характеристики тонкопленочного солнечного элемента CdS / CdTe с переходным i- слоем интерфейса из твердого раствора $CdTe_{1-x}S_x$ в зависимости от температуры.Изучены такие параметры устройства, как толщина, запрещенная зона, плотность внутренних состояний, плотность состояний, подвижность электронов и дырок, плотность ловушек, функция работы металла, температура, которые могут влиять на эффективность CdS /CdTe солнечного элемента.

Ключевые слова:

сульфид кадмия, теллурид кадмия, интерфейс, тонкопленочные солнечные элементы, твердый раствор, нанослой, толщина, запрещенная зона.

Annotation.

In this work, the current-voltage characteristics of a thin-film CdS / CdTe solar cell with a transition i-layer of the interface from a solid solution $CdTe_{1-x}S_x$ were investigated depending on the temperature. trap density, metal function, temperature, which can affect the efficiency of a CdS / CdTe solar cell.

Key words:

cadmium sulfide, cadmium telluride, interface, thin-film solar cells, solid solution, nanolayer, thickness, band gap.

Несмотря на несоответствие решетки в 10% между CdTe и CdS, сформированный гетеропереход обладает превосходными электрическими характеристиками, что приводит к высокому коэффициенту заполнения 0,77 В произведенных солнечных элементах[1,2]. СЭ с базовым слоем теллурида кадмия имеет самый высокий теоретический коэффициент полезного действия — 29% [3]. Максимальная экспериментальная эффективность 16.5% зафиксирована для СЭ на основе гетеросистем CdS/CdTe [3]. Эффективность СЭ на основе n-CdS/p-CdTe во многом определяется совершенством состава, структуры, геометрическими размерами и фазами твердого раствора (TP) $CdTe_{1-x}S_x$, который формируется на границе раздела гетероструктуры [4]. Для достижения лучшей эффективности СЭ твердый раствор должен обладать непрерывным составом на толщине d « 1 мкм и изменятся от CdS до CdTe. Использование высокотемпературной технологии при формировании n-CdS/p-CdTe — гетероструктуры приводит к увеличению содержания неконтролируемых примесей по

всей структуре, в том числе в TP. Поэтому актуальной задачей является получения n-CdS/p-CdTe – гетероструктуры с малой концентрацией неконтролируемых примесей и малыми толщинами Для проведения исследований были изготовлены переходного і-слоя. гетероструктуры по технологии, описанной в работе [4]. Верхний контакт, со стороны которого осуществляется освещение, был изготовлен из индия, напыленного в вакууме $\sim 10^{-5}$ Торр в П образной конфигурации. Тыльный контакт изготовлялся из молибдена. Базовым материалом для гетероструктуры служили пленки p-CdTe, удельное сопротивление которых равно $\rho \approx 10^3$ - 10^4 Ом⋅см, а толщина составляла ≈ 70 мкм. Пленки состоят из блоков микрокристаллов со столбчатой структурой зерен, ориентированных по направлению роста и разориентированных по азимуту. Размеры зерен находятся в пределах от 100 до 150 мкм, так что зерна охватывают все толщину пленки. Исследование вольтамперных характеристики (ВАХ) гетероструктуры проводилось в диапазоне 273-433К. Как и все другие полупроводниковые приборы, солнечные элементы чувствительны к температуре. Повышение температуры уменьшает ширину запрещенной зоны полупроводника, тем самым влияя на большинство параметров материала полупроводника. Уменьшение ширины запрещенной зоны полупроводника с ростом температуры можно рассматривать как увеличение энергии электронов в материале. Поэтому для разрыва связи необходима более низкая энергия. В солнечном элементе параметром, на который больше всего влияет повышение температуры, является напряжение холостого хода. Исследование поведения солнечных элементов с температурой (Т) важно, так как в наземных применениях они обычно подвергаются воздействию температур в диапазоне от 15 ° С (288 K) до 50 ° С (323 K). Повышение температуры уменьшает ширину запрещенной зоны полупроводника, тем самым влияя на большинство параметров материала полупроводника. Уменьшение ширины запрещенной зоны полупроводника с ростом температуры можно рассматривать как увеличение энергии электронов в материале. Поэтому для разрыва связи необходима более низкая энергия. Поэтому повышение температуры уменьшает ширину запрещенной зоны. Начальный участок ВАХ (до 0,5 В) солнечного элемента CdS /CdTe хорошо аппроксимируется известной теорией В. И. Стафеева [5].Твердый раствор i-CdTe_{1-x}S_x формирующийся между pCdTe и nCdS слоями, является высокоомным [3,8,9] и он, в основном, определяет электронные процессы в структуре в целом, в том числе и механизм переноса тока. Зависимость (1) характерна для так называемого «длинного» p-n структурного диода, т.е. когда $d/L_p>1$, где d — длина базы, $L_p=\sqrt{D_p au_p}$ — диффузионная длина неосновных носителей.

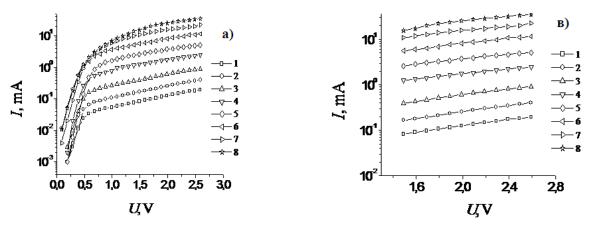


Рис.3.Вольтамперные

характеристики nCdS/pCdTe гетероструктуры в прямом направление при различных температурах (а) и их сублинейные участки (в). Обозначения BAX соответствуют следующим температурам: T, K: 1-293, 2-313, 3-333, 4-353, 5-373, 6-393, 7-413, 8-433.

Результаты исследования показывают,что значение $\mu_p \tau_p$ nCdS/pCdTe гетероструктуры с повышением температуры увеличивается. Например, значение $\mu_p \tau_p \approx 1.43 \cdot 10^{-7} \text{ см}^2/\text{B}$ при T=293 K, а при $T=353 \text{ K} - \mu_p \tau_p \approx 3.9 \cdot 10^{-7} \text{ см}^2/\text{B}$. Наличие в зависимости n(T) постоянных участков говорит о

Proceedings of Ingenious Global Thoughts An International Multidisciplinary Scientific Conference

Hosted from San Jose, California

https://conferencepublication.com

November 29th, 2020

неоднородности TP $CdTe_{1-x}S_x$ не только по проводимости, но и по составу. Исследованием температурной зависимости сублинейного участка BAX показывает, что глубокие уровни в TP $CdTe_{1-x}S_x$ распределены непрерывно и их концентрация возрастает с приближением к середине запрещенной зоны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Alam, A. Ojo, J. Jasinski, I.M. Dharmadasa, Magnesium incor-poration in n-CdTe to produce wide bandgap p-Type CdTe: Mg window layers. ChemEngineering 2(4), 59 (2018)
- 2. A.E. Alam, W.M. Cranton, I.M. Dharmadasa, Electrodeposition of CdS thin-flms from cadmium acetate and ammonium thiosul-phate precursors. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(5), 4580–4589 (2019)
- 3. K.Durose, P.R. Edwards, D.P. Holliday. J. Cryst. Growth, 197, 733 (1999).
- 4. С.А. Музафарова, Ш.А. Мирсагатов, Ж. Жанаберганов. ФТТ, Т.49, вып. 6, 1111 (2007).
- 5. В.И. Стафеев. ЖТФ, 28(9), 1631 (1958).